

干渉計フラット

Interferometer Flats



- 優れた熱安定性を持つUVフューズドシリカ使用
- 両面とも平面度 $\lambda/10$ 、表面品質10-5スクラッチ・ディグ
- わずかなウェッジ角により内部フリンジを防止
- インターフェログラムが付属

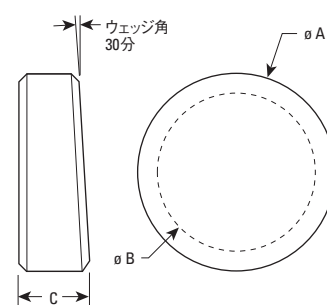
高精度で耐久性の高いこれらのフラットは、研究室用光学干渉計または品質保証基準としての使用に適しています。

仕様

基材	UVグレードフューズドシリカ
平面度	有効開口部で $\lambda/10$ (632.8nm時)
表面品質	10-5スクラッチ・ディグ
有効開口	直径中心部の80%以上
直径公差	+0/-0.25 mm
厚さ公差	± 0.5 mm
ウェッジ角	30 \pm 15 分
面取り	25.4 mm : 面幅0.25-0.76 mm \times 45 \pm 15 $^\circ$ 50.8 mm : 面幅0.38-1.14 mm \times 45 \pm 15 $^\circ$
清掃	こすらないこと。レンズ用ティッシュにアセトンまたはイソプロピルアルコールを含ませでの清掃を推奨 (P216を参照してください)
損傷しきい値	5 MW/cm ² CW、10 J/cm ² 2 nsecパルス、代表値

発注のご案内

モデル	直径 (mm)	厚さ (mm)	表面精度	表面品質
10QB20	25.4	9.52	$\lambda/10$	10-5
20QB20	50.8	12.70	$\lambda/10$	10-5



モデル	寸法 (mm)		
	øA	øB	C
10QB20	25.4	20.3	9.52
20QB20	50.8	40.6	12.70